

# SSDP-SIMSによる TFT配線交差部の深さ方向分析

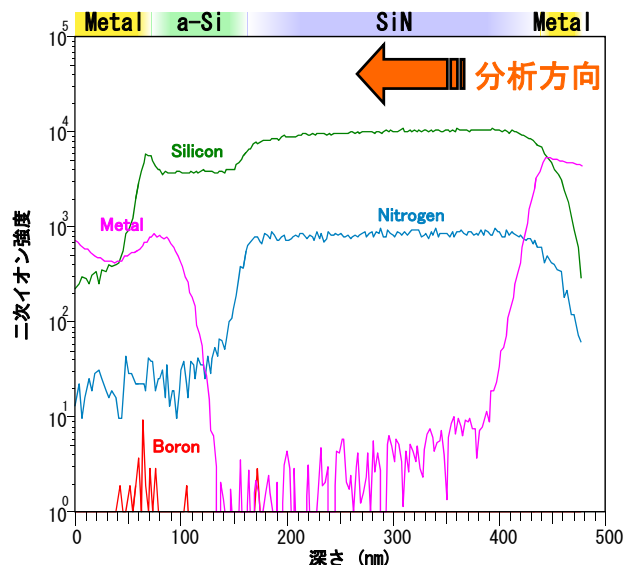
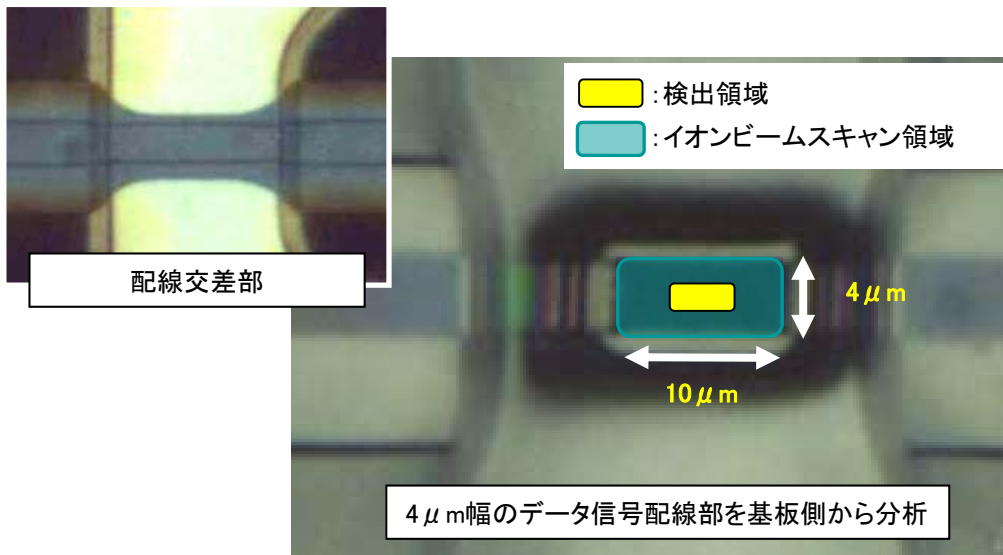
微小領域・ガラス基板についてもSSDPによる分析が可能

測定法 : SIMS・SSDP  
製品分野 : ディスプレイ  
分析目的 : 組成分布評価・製品調査

## 概要

二次イオン質量分析法(SIMS)を用いて、市販TFT液晶ディスプレイのデータ信号配線とゲート電極配線の交差部(4 $\mu\text{m}$ ×10 $\mu\text{m}$ )を、基板側から分析(SSDP-SIMS)した例を示します。基板側から測定(SSDP-SIMS)を行うことにより、表面側の高濃度層や金属膜などの影響がないデータの提供が可能となります。

## データ



分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人  
**MIST** 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp  
URL : <https://www.mst.or.jp/>